PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02254419 A

(43) Date of publication of application: 15.10.90

(51) Int. CI

G02F 1/1343

G02F 1/136

G09F 9/00

G09F 9/30

H01L 21/82

H01L 21/90

(21) Application number: 01077825

(22) Date of filing: 28.03.89

(71) Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor:

KATAYAMA MIKIO KATO HIROAKI **NAKAZAWA KIYOSHI OTOKOTO HIDENORI** KANAMORI KEN

INUI KIICHI IMAYA AKIHIKO

NAGAYASU TAKAYOSHI

(54) MATRIX DISPLAY DEVICE

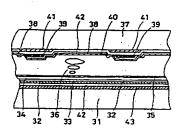
(57) Abstract:

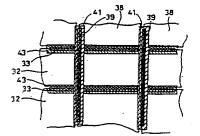
PURPOSE: To surely restore the contact failure by forming a laminated structure where a driving wiring and a correcting wiring are superposed through an insulating film.

CONSTITUTION: A scanning line 33 is formed to be brought into contact with one long side of a scanning transparent electrode 32 formed like a belt, and in a part where the scanning line 33 and a scanning use transparent electrode 32 are superposed, an electrical connection of both of them is held in any part. By bringing this matrix substrate to full driving, the position of a picture element flaw is specified. When the disconnection is generated in the scanning line 33 or a signal line 39, a linear flaw whose disconnection part is a start point is generated. When the disconnection is generated in the scanning line 33, the scanning line 33 and a correcting wiring 43 are connected electrically by breaking down an insulating film 42 by irradiating the scanning line 33 of both sides of the disconnection part and the correction wiring 43 of the lower part of those scanning lines with a laser beam. On the other hand, when the disconnection is generated in the signal line 39, as well, both lines

39, 41 are connected by breaking down the insulating film 42 by irradiating the signal line 39 and the correction wiring 41 with the laser beam in the same way.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio





BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

⑫公開特許公報(A) 平2-254419

| @Int. Cl. 5 | 識別記号 | 庁内整理番号 | ❸公開 | 平成2年(19 | 90)10月15日 |
|------------------------|------|--------------|----------------------|---------|-------------|
| G 02 F 1/1343 1/136 | 500 | - | 1 L 21/82 さ 未請求 話 | 請求項の数 2 | R※ (全9頁) |

会発明の名称 マトリクス表示装置

> 願 平1-77825 21)特

突出 願 平1(1989)3月28日

72)発 明者 片 Ш 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 @発 明 加 蒾 博 耷 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 沢 湷 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 ⑫発 則 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社

願 人 シャープ株式会社 勿出

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

四代 理 人 弁理士 山本 秀策

最終頁に続く

1、発明の名称

マトリクス表示装置

2, 特許請求の範囲

1, 少なくとも一方が透光性を有する一対の基 板と、該基板間に挿入され印加電圧に応答して光 学特性が変調される表示媒体と、該一対の基板の 少なくとも一方の基板内面に形成された表示用電 極と、該表示用電極を駆動する為の駆動用配線と、 該駆動用配線を修復する為の修正用配線と、を確 え、該駆動用配線と該修正用配線とが絶線膜を介 して重量された積層構造が設けられたマトリクス 表示装置。

2. 少なくとも一方が透光性を有する一対の基 板と、該基板間に挿入され印加電圧に応答して光 学特性が変調される表示媒体と、該一対の基板の 何れか一方の基板の内面にマトリクス状に配され た絵素電極と、該絵素電極を駆動する為のスイッ チング素子と、該スイッチング素子と該給素電極 との間を接続する絵素電揺駆動配線、及び該スイ

ッチング素子に接続された走査線と信号線を含む 駆動用配線と、該絵素電極の中央領域を除いて該 一方の基板の実質的に全面を覆う導電性遮光膜と、 を備え、該導電性遮光膜と、該絵素電極の外周部 及び該駆動用配線とが絶縁膜を介して重畳され、 該導電性絶縁膜が複数に分割され、該重量部が保 護膜によって被覆されているアクティブマトリク ス表示装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は基板間に誘電体物質を用いたマトリク ス表示装置に関し、特に液晶表示装置、 E L (E! ectric Luminescence) 表示装置、プラズマ表示 装置等に使用されるものである。

(従来の技術)

液晶表示装置、EL表示装置、ブラズマ表示装 置等のマトリクス表示装置に於いては、表示用電 極に電圧が印加され、波表示媒体の光学特性が変 調されて表示パターンが形成される。表示用電極 の駆動方式として、単純マトリクス方式、アクテ

ィブマトリクス方式等が知られている。

単純マトリクス方式の表示装置の一例の断面図 を第6図に示す。 ガラス基板31上にMoから成 る走査線33(層厚2000A)、走査用透明電 極32 (層摩1000A)、S102から成る絶縁 膜34(層厚2000点)、及び配向膜35が形 成されている。波晶層36を挟んでこの基仮31 に対向するガラス基板37上には、Moから成る 信号線39(層厚2000A)、信号用透明電極 38(暦厚1000点)、及び配向膜40が形成 されている。この表示装置を基板37側から見た 平面図を第7図に示す。第7図に示されているよ うに、走査用透明電極32の一部と走査線33の 全面とは重なっており、電気的に接続されている。 同様に、信号用透明電極38の一部と信号線39 の全面とは重なっており、電気的に接続されてい る。走査用透明電極32の走査線33に重ならな い部分と、信号用透明電極38の信号線39に重 ならない部分とが重量する領域が表示に寄与する 絵素となる。

Çi:

る。ゲートバス配線4の一部として形成されるゲ ート電極9上に、ゲート電極9の表面を陽極酸化 して得られるゲート絶縁膜10が形成されている。 この上から、ゲート絶縁膜としても機能するベー ス絶縁膜11、アモルファスシリコン(a-Si) から成る真性半導体層12、真性半導体層12の 上面を保護する保護膜16、後に形成されるソー ス電径15及びドレイン電径13とオーミックコ ンタクトを得るための n - 型半導体層 1 4 が積層 されている。更に、枝配珠8と接続されたソース 電極15、及び絵素電極6と接続されたドレイン 電極13が形成されている。TFT7及び絵素電 極6の上面を覆ってほぼ全面に保護膜17が被覆 され、さらにその上から配向膜19が形成されて いる。ガラス基板1に対向する他方のガラス基板 20の内面にはカラーフィルタ層21、対向電極 22、及び配向膜23が重量形成されている。上 記一対のガラス基板1、20の間には表示媒体と して、液晶分子18が封入されている。特にカラー - 表示を行う場合には色再現性を良くするために、

アクティブマトリクス設示装置に用いられるア クティブマトリクス基板の例を第8A図に示す。 第8B図は第8A図のアクティブマトリクス基板 を用いて表示装置を組み立て、b-b線に沿った 面で切断した断面図である。ガラス基板1上にベ ースコート膜3が全面に形成され、この上にゲー ト電径9を兼ねるゲートパス配線4及びソースバ ス配線5が格子状に配列されている。ゲートバス 配線4とソースパス配線5との間には、後述する。 ベース絶縁膜11が介在している。ゲートバス配 腺4及びソースパス配線5に囲まれた矩形の領域 には透明導電膜(ITO)から成る絵素電極6が 設けられ、マトリクス状のパターンを構成してい る。 絵素電極 6 の隔部付近にはスイッチング素子 としてTFT1が配置され、TFT1と絵素電極 5 とはドレイン選種13 によって電気的に接続さ れている。TFT7はゲートバス配線4上に設け られ、ソースパス配線 5.とは枝配線 8 で接続され ている。

TFT7付近の構成を第8B図を用いて説明す

絵素電極の外周の部分に重なるようにして、アクティブマトリクス基板上又はこれに対向する基板上に遮光膜(図示せず)が設けるられる場合が多い。

(発明が解決しようとする課題)

上述のようなマトリクス表示装置に於いては、 表示用電極に接続される駆動用配線、又はTFT で接続される走査線及び信号線と、表示用電極 でびTFTの間の絵素電極駆動配線とを含む取動用 配線に、断線不良が生じる場合がある。また、絵 素電極駆動配線と絵案電極との間にコンタクトトス 最が生じる場合がある。このような不良が発生した場合には、線状欠陥或いは絵素欠陥が生じる。 た場合には、線状欠陥或いは絵素欠陥が生じる。 このような欠陥の発生は製造歩留りを大福に低下 させるので、製造上大きな問題となる。

近年、マトリクス表示装置の欠陥部分を修正する技術の開発が行われている。特開昭 6 1 - 5 6 3 8 2 号公報には、選連に断線不良或いはコンククト不良が発生した場合に、レーザ光を該不良部分に照射して選接金属を局部的に溶融させ、導通

特開平2-254419 (3)

不良を回復する技術が開示されている。 しかし、 このような技術を用いても、 溶融させる金属層の 厚みや断線の状態によっては導通不良の回復が不 可能な場合がある。

前述の線状欠陥或いは絵紫欠陥の発生位置を特 定するには、表示装置を実際に作動させた状態で 行う方法が、簡単で正確なので適している。表示 装置を作動させた状態で、これらの欠陥は拡大鏡 等を用いて容易に視認される。これに比べ、表示 装置組み立て前の基板の状態で欠陥の発生位置を 特定するには、極めて高精度の測定機器を使用し た、複雑な検査工程を経なければならない。一方、 前述のレーザ光を用いた導通不良の修正作業は通 常、表示装置組み立て前の基板の状態で行われる。 特に各絵素電極にスイッチング素子を備えた表示 装置では、表示装置を組み立てた後にレーザ光を 照射すると、発生する熱によって殺素電極と表示 雄体との間の絶疑性が悪くなる。絶疑性が悪くな ると、スイッチング素子が存在しても絵業電極の 磁位を保つことができなくなる。このような状態

では絵素欠陥は修正され得ず、再び絵葉欠陥を生 じてしまう。 そのため、実際にはこれらの不良の 修正は、基板の状態で行われている。

(課題を解決するための手段)

本発明のマトリクス表示装置は、少なくとも一方が通光性を有する一対の基板と、該基板間に押入され印加電圧に応答して光学特性が変調される表示媒体と、該一対の基板の少なくとも一方の基板内面に形成された表示用電極と、該表示用電極を駆動する為の駆動用配線と、接駆動用配線を修

復する為の後正用配線と、を確え、該駆動用配線 と該修正用配線とが絶線膜を介して重畳された積 磨構造が設けられており、 そのことによって上記: 目的が達成される。本発明のアクティブマトリク ス表示装置は、少なくとも一方が透光性を有する 一対の基板と、該基板間に挿入され印加電圧に応 答して光学特性が変調される表示媒体と、該一対 の甚板の何れか一方の基板の内面にマトリクス状 に配された絵素電極と、該絵素電極を駆動する為 のスイッチング紫子と、該スイッチング紫子と該 絵素電極との間を接続する絵素電極駆動配線、及 び該スイッチング素子に接続された走査線と信号 線を含む駆動用配線と、該給素電極の中央領域を 除いて該一方の基板の実質的に全面を覆う導電性 遊光膜と、を備え、該導電性遮光膜と、該絵索電 極の外周部及び該駆動用配線とが絶縁膜を介して 重畳され、該導電性絶段膜が複数に分割され、該 重畳部が保護膜によって被覆されており、そのこ とにより上記目的が達成される。。

(作用)

(33.0

また、本発明の表示装置では、修正用配線としても機能する導電性遮光膜と、絵素電極の外周部及び駆動用配線とが、絶縁膜を介して重量され、該導理性遮光膜が複数に分割されている。 この構成により、駆動用配線に断線不良が発生している場合、或いは絵素電極駆動配線と絵素電極との間にコンタクト不良等が発生している場合には、容

易に接不良箇所を修復することができる。即ち、 不良箇所の両側の駆動用配線或いは絵案電優と導 磁性選光膜との重量部にレーザ光を照射すること によって修復することができる。レーザ光が照射 されると、駆動用配線或いは絵葉電極と導電性途 光膜との間の絶縁膜が破壊され、上記不良が解消 される。

更に、本発明の表示装置は、駆動用配線及び絵 素電値と、導電性進光膜との重量部分を保護膜で 覆った構成を有する。 そのため、表示装置を組み 立てた後にレーザ光を照射しても、発生する熱に よって絵業電極と表示媒体との間の絶縁性の低下 が生じることはない。

(寒胞例)

本発明を実施例について以下に説明する。第1 図に本発明のマトリクス表示装置の一実施例の断面図を示す。本実施例は単純マトリクス型の表示装置である。がラス基板31上にMoから成る修正用配線43(層厚2000人)、及び修正用配線43を復い、基板全面に亙るS102から成る絶 繰り42(暦厚3000A)が形成されている。 その上から篠正用配線43に重畳して、Mo金属の走査線33(暦厚2000A)、及び走査線3 3上に接して走査用透明建極32(暦厚1000 A)が形成されている。更にその上から、SiO 2の絶縁膜34(暦厚2000A)、配向膜35が 順次形成されている。

この基板31に対向するガラス基板37上にも同様に、Moから成る様正用配線41(層厚2000人)、及び修正用配線41を覆い基板全面に互るS10gから成る絶線膜42(層厚3000人)が形成されている。その上から修正用配線41に重量して、Mo金属の信号線39(層厚2000人)、及び信号線39上に接して信号用透明電極38(層厚1000人)が形成されている。更にその上から、配向膜40が形成されている。前述のガラス基板31とは異なり、ガラス基板37上には絶縁膜34に相当する膜は殺けられていない。

第2図はガラス基板37側から見たこの表示装置の平面図である。走査線33は、帯状に形成さ

れた走査用透明電極32の一方の長辺に接して形成され、走査線33と走査用透明電極32ととが重要する部分では、何れのいろ。同様にしてもの間の電気のは、帯状に形成された信号用透明39は、帯状に形成された信号用透り38の一方の長辺に変ける部分では、信号線39に対しても両者の間の電気の対策が保証が保証のでは、発売用透明電極32の走査線33に位のでは、走費用透明電極32の走査線33にでのないる。走費用透明電極32の走査線33にでいる。ない部分とが重量する領域が多いになる。これらの基板31及び37には、表示用媒体として液晶分子36が封入されている。

上述の構成を有するマトリクス基板を全面駆動することにより、 絵集欠陥の位置が特定される。 走査線 3 3 又は信号線 3 9 に断線が生じている場合には、断線部を始点とする線欠陥が発生する。 走査線 3 3 及び信号線 3 9 の何れに断線が発生しているかは、発生した線欠陥の方向によって知る ことができる。断線が走査線33に発生している場合には、該断線部の両側の走査線33とそれら走査線下方の接正用配線43とにレーザ光を照射して絶線膜42を破壊し、走査線33と修正用配線43との間を電気的に接続する。同様に、断線が信号線39に発生している場合には、該断線部の両側の信号線39とそれら信号線の下方の修正用配線41とにレーザ光を照射して絶縁線42を破壊し、信号線39と修正用配線41との間を変気的に接続する。以上のようにして欠陥を修正することができる。

本発明の他の実施例として、アクティブマトリクス型の表示装置を挙げることができる。 第3A 図にその表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の平面図を示す。 第3B 図に第3A 図のアクティブマトリクス基板を用いた表示装置の、第3A 図に於けるB-B線に沿った断面図を示す。がラス基板1上にTa、A1、Mo、N1等の単産若しくは多種金属膜、又は樹脂等から成る導電性発光膜2が形成されている。本実施例では厚き

約3000人のTaを用いた。導電性遮光膜2は、 後に形成される絵素質様もの外周部とゲートバス 配線4とソースパス配線5とに一部重量するよう に枠状に形成され、更に枠の周方向に沿って4個 の部分2 a ~ 2 d に分割されている。導質性遮光 膜2を覆い基板1の全面に亙って、TagO 5、A 1203、S12N4等から成るペースコート膜3(層厚約3000人)が堆積され、走査線として作 用するゲートバス配線4(層厚4000人)、及 び信号線として作用するソースパス配線5(層厚 3000人)が格子状に形成されている。ゲート 、パス配線4は一般にTa。Al、Tl、NL、M o等の単層若しくは多層金属膜で形成されるが、 本実施例ではTaを使用している。ソースバス配 線5も同様の金属で形成されるが、本実施例では Tiを使用している。ゲートバス配線4とソース パス配線 5 の交差位置には、後述するペース絶縁 膜11が介在している。ゲートバス配線4及びソ ースパス配線5で囲まれた矩形の領域には、透明 導越膜(1T0)から成る絵素電極8が配置され、

マトリクス状の絵楽パターンを構成している。 絵 索電揺6の隅部付近にはスイッチング案子として TFT7が配置される。TFT7はゲートバス配 線4上に形成される。TFT7のソース超極15 とソースパス配線5とは、 技配線8によって接続 されている。TFT7と絵素電揺6とはドレイン 電極13によって電気的に接続されている。

TFT7付近の構成を第38図に従って説明する。ガラス基板1上に導電性選光膜2dが形成され、この選光膜2dを覆い基板全面に亙って、ベースコート膜3が形成されている。ベースコート膜3が形成されている。ベースコートでは、ゲートでは、ゲートでは9が形成される。その上には、ゲートでは9の表面を関係して得られるTa2O3から成るゲートを線膜10が形成されている。ゲート絶縁膜10上には、ゲート絶縁膜10上には、ゲート絶縁膜10元、発展10元、発展11元、コース11度性半導体層12、SiNxから成る半導体保護膜16、ソースを得るたびドレイン電極とオーミックコンタクトを得るた

めの、a-Siから成るn型半導体層14が順次 **薄磨されている。 n 型半導体層 1 4 上には、枝配** 線8と接続されたソース電径15、及び絵業電極 6と接続されたドレイン部様13が形成されてい る。半導体保護膜18は真性半導体層12の上面 を保護し、ソース電極15とドレイン電極13と をエッチングによって分離する際にエッチングス トッパとして作用し、真性半導体層12が電極エ ッチング液に曝されるのを防止する。ソース電極 15及びドレイン電極13は、TI、NI、AI 等によって形成される。 検索電極 6 はペース絶縁 膜11上にパターン形成される。ペース絶録膜1 1の厚さは1500人~6000人程度が適当で あるが、本実施例では2000A~3500Aに 設定している。TFT7及び接着関極6の上面を 理ってほぼ全面にSINxから成る保護膜17が彼 覆され、保護膜17上には表示媒体である液晶分 子18の配向を規制する配向膜19が堆積されて いる。配向膜19はS102、ポリイミド系樹脂等 から成る。保護膜17の厚さは2000点~10

000 A程度が適当であるが、本実施例では5000 A前後に設定している。尚、ベース絶縁膜11及び保護膜17としてはSiNx以外に、SiOx、Ta2O5、AI2O2、TIO2、Y2O3等の酸化物や変化物を用いることができる。また、保護膜17と検索電極6との間の電気二重層の形成を防止するために、保護膜17を検索電極6の中央部で除去した窓あき構造としてもよい。

絵素電極6の形成されたガラス基板1に対向する他方のガラス基板20の内面には、カラーフィルタ層21、絵素電極6に対向する対向電極22、及び配向層23が重畳形成されている。

上記一対のガラス基版1、20の間には表示媒体として、ねじれ配向されたツィステドネマチック液晶分子18が封入され、絵素電極6と対向電極22との間の電圧印加に応答して配向変換されることにより光学的変調が行われる。

上記構成からなるアクティブマトリクス表示装置の全ゲートバス配線 4 及び全ソースバス配線 5 から、TFT7を介して全絵素電極 6 を駆動する

特開平2-254419(6)

ことによって、 絵 素欠陥の 発生位置を 光学的 に特定する ことができる。

絵素欠陥は導電性遮光膜 2 を用いて修復される。 第4 図はソースパス配線 5 の断線部が修復される 様子を模式的に示した図である。第4図の矢印2 4 で示すように、透明性基板! 側から断線部の両 側の、導電性遮光膜2とソースバス配線5とが重 豊する部分に、レーザ光、赤外線、電子ビームモ の他の熱頭からのエネルギーが照射される。本実 施例ではYAGレーザ光を用いた。レーザ光の照 射によってベースコート膜3及びベース絶縁膜1 1が破壊され、導電性遮光膜2とソースパス配線 5とが相互に溶融して接続される。このようにし て断線部の一方の側のソースパス配線 5部分と、 他方の側のソースパス配線5部分とが導電性遮光 膜2を介して電気的に接続され、断線部が修復さ れる。ゲートバス配線4に断線が生じている場合 にも同様にして修復することができる。この場合 には、レーザ光照射によってゲートバス配線4と 導電性遮光膜 2 との間のベースコート膜 3 が破壊

され、ゲートベス配線4と導電性遮光膜2とが電気的に接続される。 絵楽電極6とドレイン電極13との間にコンタクト不良が生じている場合には、 絵楽電極6と導電性遮光膜2との重量部分、及び 導電性遮光膜2とドレイン電極13との重量部分 にレーザ光が照射される。これらの部分にレーザ 光を照射することによって、ドレイン電極13と 絵楽電極6とが導電性遮光膜2を介して電気的に 接続される。

上述のレーザ光の照射による断線或いはコンタクト不良部分の修復は、保護膜17とガラス基板1との間で行われる。保護膜17は透明絶縁をであり、レーザ光を透過させる。そのため、レーザ光を透過させる。そのため、は導電性のので、四番をはない。そして、保護膜17が破壊されることはない。そして、保禁電極6と表示媒体である液晶分子18との間を生じないので、再び絵素欠陥を生じ

ることもない。

上記実施例はTFTを用いたアクティブマトリクス液晶表示装置であるが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明はMIM案子、ダイオード、バリスタ等のスイッチング素子を用いた表示装置にも適用可能である。

また、本発明は表示媒体として、薄膜発光層、 分散型 E L 発光層、プラズマ発光体等を用いた各種表示装置にも適用することができる。

(発明の効果)

本発明の表示装置は、駆動用配線に生じた断線不良、或いは絵業電極駆動配線と絵業電極との間に生じたコンタクト不良を確実に修復できる構成を有する。そのため、表示装置の製造が留りが向上する。また、本発明の表示装置は、絵業欠陥の発生位置を容易に特定できる表示装置の状態で、絵業欠陥の修正を行うことができる。そのため、検査工程及び修復工程が躊略化され、表示装置の量産化、コスト低減等に寄与することができる。

第1. 図は本発明の一実施例の単純マトリクス表示装置の断面図、第2. 図は第1. 図の表示装置を基板3.7 側からみた平面図、第3.A 図は本発明の他の実施例に用いられるアクティブマトリクス基板の平面図、第3.B 図は第3.A 図のアクティブマトリクス基板を用いた表示装置の、第3.A 図に於け

るB-B線に沿った断面図、第4図は第3A図の 基板上に生じたソースバス配線の断線部が修復される様子を示す図、第5図は本発明の他の実施例 のTFT近傍の積層構造を示す図、第6図は従来 の単純マトリクス表示装置の一例を示す図、第7 図は第6図の表示装置を基板37例から見た平面 図、第8A図は従来の表示装置に用いられるアク ティブマトリクス 基板の一例を示す平面図、第8 B図は第8A図の基板を用いた表示装置の、第8 A図に於けるb-b線に沿った断面図である。

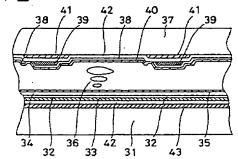
1,20,31.37…ガラス基板、2…導電性遮光膜、3…ベースコート膜、4…ゲートバス配線、5…ソースバス配線、6…检索電極、7… TFT、9…ゲート電極、11…ベース絶縁膜、13…ドレイン電極、15…ソース電極、17…保護膜、18,36…液晶分子、19,23,35,40…配向層、21…カラーフィルタ、22…対向電極、32…走齊開透明電極、33…走齊線、34…絶縁膜、38…信号開、42…絶縁

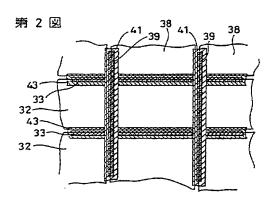
膜。

以上

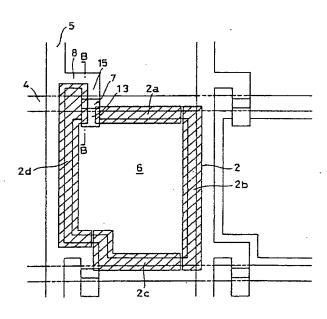
出願人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策

第1図



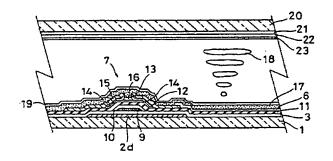


第 3A 図

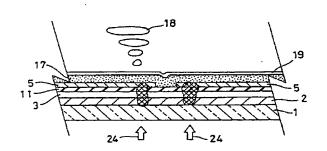


特開平2-254419(8)

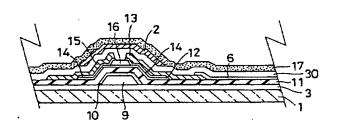
第 3 B 図



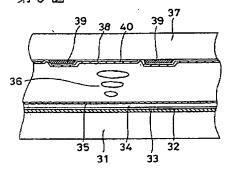
第 4 図



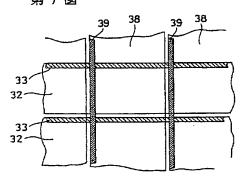
第 5 図



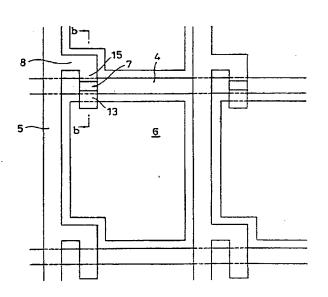
第6図



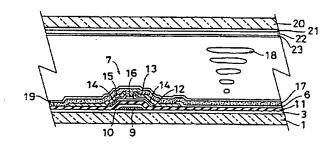
第 7 図



第 8 A 図



第8B図



| 第1頁の続き | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|--------------|---|----------------|---|--------------------------|----------|--|
| Solnt. Cl. 5 | | | | | 韶 | 說記号 | | 庁内整理番号 | | |
| | G | 09 | F | 9/00 9/30 | | 3 5 2 3 3 8 | | 6422-5C 6422-5C | | |
| | Н | 01 | | 21/82 | | 330 | | | | |
| | | | | 21/90 | | | A | 6810-5F | | |
| | @発 | 明 | 者 | 金 | 森 | | 謙 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 内 | シヤープ株式会社 | |
| | ⑫発 | 明 | 者 | 乾 | | 基 | _ | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 内 | シャープ株式会社 | |
| | @発 | 明 | 者 | 今 | 矢 | 明 | 彦 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 内 | シヤープ株式会社 | |
| | @発 | 明 | 者 | 永 | 安 | 孝 | 好 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 内 | シャープ株式会社 | |
| | | | | | | | | | | |